陈依皓

(北京师范大学 物理学系, 北京 100875)

摘 要:本次实验的目的是:加深理解光的干涉以及光源的相干性; 学习利用分立元件搭建迈克耳孙干涉仪的方法; 学习利用迈克耳孙干涉仪测量微小物理量(波长、空气折射率等)的方法。

关键词:干涉,迈克尔逊干涉仪,测量微小物理量

中图分类号: 0xx

文献识别码: A

文章编号: 1000-0000(0000)00-0000-00

1 引言

光的干涉指的是两列相干的光波叠加, 总光强会因它们的相位差而改变的现象。设。 两列光波干涉形成的光强

$$I = I_1 + I_2 + \sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta \varphi$$

相位差 $\Delta \varphi$ 在空间各点不同,导致总光强呈现亮暗分布的图样,即干涉条纹。

两列光波初相位相同时,相位差 $\Delta \phi$ 与

光程差Δs的关系是

$$\Delta \varphi = 2\pi \frac{\Delta s}{\lambda}$$

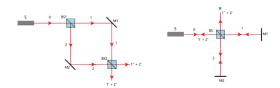
由于 λ 很短,微小的位移或折射率变化就可以产生可观的干涉条纹变化,因此光的干涉经常用于精密测量。

2 实验原理

2.1 迈克耳孙干涉仪

2.1.1 常见干涉仪

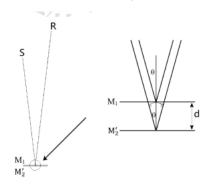
在实验室观察光的干涉需要将来自同一光源的光分成两路,让它们经过不同路径后再汇合。Mach – Zehnder干涉仪与Michelson干涉仪光路图如图所示



2.1.2 等倾干涉

为了观察到等倾干涉条纹, M1, M2的取向需要相对分束膜镜像对称。两路光的光程差就是从S出发,经M1 和M2'反射到R的两条光线的光程差。

$$\Delta s = 2dn_0cos\theta$$



2.1.3 等厚干涉

当膜M1和M2'的位置很接近(甚至存在交叠), 同时存在一定倾角时,光程差主要由两个 镜面之间空气层的厚度决定,产生等厚干涉 条纹

2.1.4 白光干涉

对于白炽灯或发光二极管等非相干光源,由于相干长度很短,需要d接近零时才能观察到干涉条纹

2.2 利用干涉仪进行测量

2.2.1 基本原理

对于单色光产生的等倾干涉,中心点条纹的 级次为

$$l = \frac{\Delta s}{\lambda} = \frac{2dn_0}{\lambda}$$

移动镜M1 的位置,通过直线拟合可以测量光的波长。

对于非单色光, 而是包含两条波长很近的谱

线的情况,可以利用等倾干涉条纹测量波长 差。

$$\Delta l = l_1 - l_2 = \frac{2n_0d}{\lambda_1} - \frac{2n_0d}{\lambda_2} \approx \frac{2n_0d\Delta\lambda}{\bar{\lambda}^2}$$

Δ*l*为整数则为亮条纹,半整数则为暗条纹,测量条 D

$$D = \frac{\bar{\lambda}^2}{2n_0 \Delta \lambda}$$

只要能把物理量转化成光程差,就可以通过 等倾干涉条纹的变化量来测量

2.2.2 测量空气折射率

空气的折射率相对真空折射率的增加量与 空气的密度成正比

$$n-1=\alpha P$$

在一条光路中放置一个上下底面都安装有平面玻璃窗的圆柱体气室,使光束垂直穿过玻璃窗,使气室的压强改变 ΔP ,则光程改变

$$\delta S = 2L\Delta n = 2L\alpha\Delta P$$

这会引起等倾干涉条纹移动

$$\Delta l = \frac{\delta s}{\lambda} = \frac{2L\alpha}{\lambda} \Delta P$$

可得到 α ,联立理想气体状态方程

$$n_s = 1 + \frac{T}{T_0} \alpha P_0$$

2.2.3 白光干涉法测量薄膜折射率

调节动镜位置找到白光干涉。然后在一条光路中放入待测透明薄膜并使光垂直穿过,引入额外的光程差为

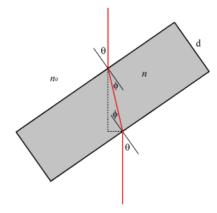
$$\delta = 2(n - n_0)d$$

这时白光干涉条纹消失。要再次出现白光干涉条纹,需要改变一个反射镜的位置补偿光

程差的改变,移动量 $\Delta = \frac{\delta}{2n_0}$,因此得

$$n = n_0(1 + \frac{\Delta}{d})$$

2.2.4 斜入射法测量材料折射率



将一块透明平板插入迈克耳孙光路,引入的 额外光程差为

$$\delta s(\theta) = 2(nL - n_0 L_0)$$

由几何关系

$$\delta s(\theta) = 2d(\frac{n}{\cos \phi} - \frac{n_0 \cos(\theta - \phi)}{\cos \phi})$$

从垂直入射开始旋转平板改变光程差,如果 转到 θ 时总共移动了k个条纹

$$n = n_0 + \frac{\left(n_0 cos\theta + \frac{\epsilon}{2}\right)\epsilon}{n_0(1 - cos\theta) - \epsilon} \quad \epsilon = k\lambda/2d$$

3 实验内容

- 3.1 搭建迈克耳孙干涉仪,观察等倾干涉 条纹。
- 3.2 利用等倾干涉测量激光的波长。
- 3.3 利用等倾干涉测量空气的折射率。
- 3.4 观察白光干涉,测量薄膜(或玻璃片)的折射率。
- 3.5 利用斜入射法测量玻璃的折射率。

4 预习思考题

- 1. **两列光波能够产生干涉的条件是什么?** 干涉是由两列相干光波叠加而产生的现象。 两列光波能够产生明显的干涉,需要满足:
- 1.两列光波必须是相干的,即它们的频率相 同且具有固定的相位关系。
- 2.两列光波的传播方向必须相同或足够接近。
- 2. 根据等倾干涉的光程差公式解释: (i)为

什么随着 d 的增大,条纹间距会变小? (ii) 条纹间距为什么里疏外密?

$$\Delta s = 2dn_0 cos\theta$$

(i)

对于干涉级为j和j+1的两个相邻的亮条纹

$$2dn_0cos\theta_1=\left(j+\frac{1}{2}\right)\lambda$$

$$2dn_0cos\theta_2 = \left(j + 1 + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

两式相减得

$$n_0(cos\theta_2-cos\theta_1)=\lambda/2d$$
 θ 为小量时

$$\theta_2 - \theta_1 = \lambda/n_0 d$$

可知d越大, $\theta_2 - \theta_1$ 越小,相邻的亮条纹之间的距离越小,条纹越密。

(ii)

由

$$2dn_0cos\theta = \Delta s$$

可知随着 θ 的增大,光程差变化越来越快,由此条纹间距里疏外密。

3. 对于等倾干涉条纹,改变接收屏的位置, 条纹如何改变?改变扩束镜的位置呢?

如果接收屏靠近其中一侧,光程差减小,干涉条纹不断向中心"缩进"。

如果接收屏远离其中一侧,光程差增大,导干涉条纹不断向中心"冒出"。

扩束镜的位置变化会改变入射光波的角度, 使得光程差发生变化,引起干涉条纹的移动, 也可能导致整体条纹的形状发生改变。

4. 为了判断等倾干涉时哪一路的光程较长,可以对光程差进行微扰,比如按动光学面包板或用热的物体靠近一条光路,观察干涉条纹如何变化。这样做的原理是什么?应如何判断?

按动面包板或用热的物体靠近一条光路,则这条光路的光程会发生变化(变大或变小?)只需要根据干涉条纹的变化(缩进或涌出)则可以判断该条光路是较长的一条还是较短的一条。

5. 为什么需要在光程差很小时才能观察到 白光干涉? 光程差减小时等倾干涉条纹如 何变化?

在光程差很小时,光波的相干性要求相对容易满足,才能产生明显的干涉。当光程差减小时,等倾干涉条纹会变得更加密集,条纹间距减小。

6. 对于斜入射法测量折射率,如何根据干涉条纹变化规律判断正入射($\theta = 0$)?

正入射时额外光程差为极小值,只需要观察 干涉条纹缩进最多的情况(可以通过不断调整透明平板的角度)此时即为正入射。

参考文献

[1] 北京师范大学物理实验教学中心. 普通物理实验讲义 II, 2023

Construction and application of Michelson interferometer

CHEN Yi-hao

(Department of Physics, Beijing Normal University, Beijing 100875, China)

Abstract: The purpose of this experiment is to deepen the understanding of the interference of light and the coherence of light source; Learning the method of constructing Michelson interferometer with discrete elements; Learn how to measure small physical quantities (wavelength, refractive index of air, etc.) with Michelson interferometer.

Key words: Interference, Michelson interferometer, measures small physical quantities